



「放射光が拓く表面科学のフロンティア」

講演プログラム

- 13:00-13:05 あいさつ
高橋功 (関学大)
- 13:05-13:25 MgO基板表面上のCr薄膜からのRHEED
阪上潔 (関学大)
- 13:25-13:45 The effect of microstructure of polyoctylfluorene thin film
on its photoluminescence
Zhang Jidong (Changchun Institute of Applied Chemistry)
- 13:45-14:05 電極表面と弱く相互作用した吸着種の構造
中村将志 (千葉大)
- 14:05-14:25 多波回折を利用したシリコン酸化膜／シリコン界面下のひずみの測定
- 深さ方向分布の定量解析
矢代航 (東大)
- 14:25-14:45 圧電体の時間分解XRDおよび電気特性の同時測定
舟窪浩 (東工大)
- 14:45-15:00 休憩
- 15:00-15:20 β -FeSi₂/Si(001)熱反応堆積成長のその場X線回折: α -FeSi₂相の
成長と消滅
花田貴 (東北大)
- 15:20-15:40 酸化物表面のX線回折:酸化チタンの触媒反応機構を
解明するための表面構造解析からのアプローチ
田尻寛男 (JASRI)
- 15:40-15:50 CRESTで導入したピクセル検出器の現状
山中宏晃 (JASRI, 兵庫県立大)
- 15:50-16:00 マイクロ回折計+CCD検出器による逆格子マップの迅速測定の現状
木村滋 (JASRI)
- 16:00-16:10 ビームラインの現状、高度化の可能性について
坂田修身 (JASRI)
- 16:10-16:50 全体討論
(司会 坂田修身)
- 16:50-16:55 おわりに
吉本護 (東工大)

日時 2009年8月4日(火) 13:00-16:55
場所 関西学院大学 梅田キャンパス 1406号室
(大阪市北区茶屋町19-19 アプローチタワー14階)

参加費無料

連絡先: 関西学院大学理工学部・高橋功 (079-565-9722, z96019@kwansei.ac.jp)